



Defektoskop OmniScan™ X3 Wiarygodność, którą możesz zobaczyć

Rewelacyjna jakość obrazów i starannie przemyślane oprogramowanie — wzór przenośnego defektoskopu Phased Array stał się jeszcze doskonalszy. Nowe zaawansowane narzędzia do inspekcji spoin, w tym akwizycja obrazów TFM (Total Focusing Method) techniką Full Matrix Capture (FMC), umożliwiają szybką realizację zadań i wiarygodną interpretację wykrytych wad.

O optymalizację wyników TFM można zadbać jeszcze przed rozpoczęciem inspekcji, korzystając z narzędzia mapy wpływu akustycznego — Acoustic Influence Map (AIM). Generuje ono wizualną mapę efektów ogniskowania TFM na podstawie trybu i ustawień wybranych przez użytkownika.

Weryfikację właściwego pokrycia spoiny ułatwia wizualizacja z użyciem wielu grup.

Do ustalania charakterystyki dużych wskazań, takich jak brak wtopienia, wystarczy mniejsza liczba powtórnych skanów dzięki poszerzonemu zakresowi wysokiej amplitudy (800%).

Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się więcej

